(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-204529

(43)公開日 平成11年(1999)7月30日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FI		
H 0 1 L 21/3205	may yan 'y	HOIL	21/88	В
B41J 2/01		B41J	3/04	101Z

・療査請求 未請求 請求項の数38 ○Ⅰ (全 16 頁)

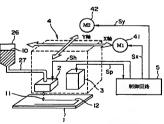
		審查請求	未請求 請求項の数38 OL (全 16 頁)	
(21)出願番号	特顧平10-8016	(71)出額人	000002369 セイコーエプソン株式会社	
(22)出顧日	平成10年(1998) 1月19日	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号		
		(72)発明者	木口 治史 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ	
			ーエブソン株式会社内	
		(72)発明者	下田 達也 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエブソン株式会社内	
		(72)発明者	福島 均 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエプソン株式会社内	
		(74)代理人	弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 パターン形成方法および基板製造装置

(57) 【要約】

【課題】 インクジェット方式を使用して基板にバター ン形成を可能とする基板の製造技術を提供する。

【解決手段】 流動体11により基板1上に任意のバターンを形成するための基板製造装能に関する。当該装置は、流動体11を基板1上に吐出可能に構成されたインクジェット式記録ヘッド2、基板1上に一定の処理を行う処理手段3、インクジェット式記録ヘッド2からの流動体段4、およびインクジェット式記録ヘッド2からの流動体1の吐出、処理手段3による処理並びに駆動手段4による処理をインクジェット式記録ヘッド2からの流動体の転割を開御する制御手段5位、処理手段による処理をインクジェット式記録ヘッド2からの流動体の吐出に先行して行わせることが可能に構成される。



100: 基板製造装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクジェット式記録ヘッドより所定の 流動体を基板上に吐出して任意のパターンを形成するパ ターン形成方法であって.

前記流動体の吐出前に予め前記基板上に一定の処理を行 うステップと、

前記処理をした基板上に前記インクジェット式記録へッドより前記流動体を吐出するステップと、を備えたことを特徴とするパターン形成方法。

【請求項2】 インクジェット式記録ヘッドより所定の 流動体を基板上に吐出して任意のパターンを形成するパ ターン形成方法であって、

前記インクジェット式記録ヘッドより所定の流動体を基 板上に吐出するステップと、

前記流動体が吐出された前記基板に一定の処理を行うステップと、を備えたことを特徴とするパターン形成方

【請求項3】 インクジェット式記録ヘッドより所定の 流動体を基板上に吐出して任意のパターンを形成するパ ターン形成方法であって、

前記インクジェット式記録ヘッドより所定の流動体を吐 出するステップと、

前記インクジェット式記録ヘッドより吐出された流動体 が前記基板に到達する前までに、当該吐出された流動体 の液滴に一定の処理を行うステップと、を備えたことを 物物とするパターン形成方法。

【請求項4】 前記処理は、前記流動体に化学的作用を 及ぼす処理である請求項1乃至請求項3のいずれか一項 に記載のパターン形成方法。

【請求項5】 前記処理は、前記流動体に含まれる所定 30 物質の溶解度を低下させ、当該物質を析出させる処理で ある請求項1または請求項2に記載のパターン形成方 注

【請求項6】 前記処理は、前記流動体に化学反応を生 じさせる物質を前記基板に吐出する処理である請求項1 または請求項2に記載のパターン形成方法。

【請求項7】 前記処理は、前記流動体に物理的作用を 及ぼす処理である請求項1乃至請求項3のいずれか一項 に記載のパターン形成方法。

【請求項8】 前記処理は、前記パターン形成領域の境 40 界に沿って吐出された前記流動体の境界を整形する処理である請求項2に記載のパターン形成方法。

【請求項9】 前記処理は、前記パターン形成領域に沿って吸収体を移動させることにより、温剰な前記流動体を前記吸収体に吸収させる処理である請求項2に記載のパターン形成方法。

【請求項10】 前記処理は、前記流動体に物理化学的 作用を及ぼす処理である請求項1万至請求項3のいずれ か一項に記載のパターン形成方法。

【請求項11】 前記処理は、前記基板のうち前記パタ 50

ーン形成領域の周囲を前記流動体に対し非親和性に表面 改質する処理である請求項1に記載のバターン形成方 注

【請求項12】 前記処理は、前記基板のうち前記パターン形成領域を前記流動体に対し親和性に表面改質する 処理である請求項1に記載のパターン形成方法。

【請求項13】 前記処理は、前記基板のうち前記パターン形成領域を、前記流動体を吸収する吸収層に表面改質する処理である請求項1に記載のパターン形成方法。

【請求項14】 前記処理は、前記パターン形成領域の 周囲に前記流動体が流出することを防止するためのパン クを形成する処理であって、

前記パターンの形成後当該パンクを除去する工程をさら に備える請求項2に記載のパターン形成方法。

【請求項15】 前記処理は、既に前記添動体が吐出されている前記パターン領域に沿ってさらに同一の流動体を吐出する処理である請求項2に記載のパターン形成方法。

【請求項16】 前配処理は、前配液滴にエネルギーを サ給し、当該流動体の濃度を上昇させる処理である請求 項3に記載のパターン形成方法。

【請求項17】 前記処理は、前記液滴にエネルギーを 供給し、当該液滴の軌道を曲げる処理である請求項3に 記載のバターン形成方法。

【請求項18】 前配処理は、前配流動体に化学反応を 生じさせる物質を、前記液滴に作用させる処理である請 求項3に記載のパターン形成方法。

【請求項19】 前記処理は、前記液滴の属性を検出する処理であって、

検出された前記液滴の属性に基づいて、前配インクジェット式記録へッドからの前記液滴の吐出を制御するステップをさらに備える請求項3に記載のパターン形成方 建

【請求項20】 所定の流動体により基板上に任意のパ ターンを形成するための基板製造装置であって、 前記流動体を前記基板上に吐出可能に構成されたインク

前記基板上に一定の処理を行う処理手段と、

ジェット式記録ヘッドと、

前記インクジェット式記録ヘッドおよび前記処理手段と 40 前記基板との相対位置を変更可能に構成される駆動手段 と、

前記インクジェット式記録ヘッドからの前記流動体の吐 出、前記処理手段による前記処理並びに前記駆動手段に よる駆動を制御する制御手段と、を備え、

前記制御手段は、前記処理手段による処理を前記インクジェット式記録ヘッドからの流動体の吐出に先行して行わせることが可能に構成された基板製造装置。

【請求項21】 所定の流動体により基板上に任意のパ ターンを形成するための基板製造装置であって、

前記流動体を前記基板上に吐出可能に構成されたインク

ジェット式記録ヘッドと.

前記基板上に一定の処理を行う処理手段と、

前記インクジェット式記録ペッドおよび前記処理手段と 前記基板との相対位置を変更可能に構成される駆動手段 と、

前記インクジェット式記録ヘッドからの前記流動体の吐出、前記処理手段による前記処理並びに前記駆動手段による駆動を制御する制御手段と、を備え、

前記制御手段は、前記インクジェット式記録ヘッドから の流動体の吐出を処理手段による処理に先行して行わせ 10 ることが可能に構成された基板製造装置

【請求項22】 所定の流動体により基板上に任意のパターンを形成するための基板製造装置であって、

前記流動体を前記基板上に吐出可能に構成されたインク ジェット式記録ヘッドと.

前記インクジェット式記録ヘッドから吐出された流動体 の被滴が基板に到達する前に当該被滴に一定の処理を行 う処理手段と、

前記インクジェット式記録ヘッドおよび前記処理手段と 前記基板との相対位置を変更可能に構成される駆動手段 20 と、

前記インクジェット式記録ヘッドからの前記流動体の吐出、前記処理手段による前記処理並びに前記駆動手段による駆動を削御する制御手段と、を備えたことを特徴とする基板製造装置。

【請求項23】 前記処理手段は、前記流動体に化学的 作用を及ぼすことが可能に構成される請求項20乃至請 求項22のいずれか一項に記載の基板製造装置。

【請求項24】 前記処理手段は、前記流動体に含まれる所定物質の溶解度を低下させ、当該物質を析出させる。 ことが可能に構成される請求項20または請求項21に記載の基板製造装置。

【請求項25】 前記処理手段は、前記流動体に化学反 応を生じさせる物質を前記基板に吐出することが可能に 構成される請求項20または請求項21に記載の基板製 造装置。

【請求項26】 前記処理手段は、前記流動体に物理的 作用を及ぼすことが可能に構成される請求項20万至請 求項22のいずれか一項に記載の基板製造装置。

【請求項27】 前記処理手段は、前記パターン形成領域の境界に沿って吐出された前記流動体の境界を整形可能に構成される請求項21に記載の基板製造装置。

【請求項28】 前記処理手段は吸収体を備え、前記制 御手段は前記パターン形成領域に沿って前記吸収体を相 対的に移動させることにより、過剰な前記流動体を前記 吸収体に吸収させる請求項21に記載の基板製造装置、

【請求項29】 前記処理手段は、前記流動体に物理化 学的作用を及ぼすことが可能に構成される請求項20万 至請求項22のいずれか一項に記載の基板製造装置。

【請求項30】 前記処理手段は、前記基板のうち前記 50

パターン形成領域の周囲を前記流動体に対し非親和性に 表面改質することが可能に構成される請求項20に記載 の基板製造装置。

【請求項31】 前記処理手段は、前記基板のうち前記 パターン形成領域を前記流動体に対し親和性に表面改質 することが可能に構成される請求項20に記載の基板製 流生器

【請求項32】 前記処理手段は、前記基板のうち前記 パターン形成領域を、前記流動体を吸収する吸収層に表 面改質することが可能に構成される請求20に記載のパ ターン形成方法。

【請求項33】 前記処理手段は、前記パターン形成領域の周囲に前記流動体が流出することを防止するためのバンクを形成可能に構成され、

当該製造装置は、前記パターンの形成後当該パンクを除 去する手段をさらに備える請求項22に記載の基板製造 な歴

【請求項34】 所定の流動体により基板上に任意のパターンを形成するための基板製造装置であって、

前記流動体を前記基板上に吐出可能に構成されたインク ジェット式記録へッドと

前記インクジェット式記録ヘッドと前記基板上との相対 位置を変更可能に構成される駆動手段と、

前記インクジェット式記録ヘッドからの前記流動体の吐出および前記駆動手段による駆動を制御する制御手段 と、を備え

前記制御手段は、既に前記流動体が吐出されている前記 パターン領域に沿って前記インクジェット式記録ヘッド からさらに同一の流動体を吐出する基板製造装置。

【請求項35】 前記処理手段は、前記被滴にエネルギーを供給し、当該流動体の濃度を上昇させることが可能 に構成される請求項22に記載の基板製造装置。

【請求項36】 前記処理手段は、前記被適にエネルギーを供給し、当該液滴の軌道を曲げることが可能に構成される請求項22に記載の基板製造装置。

【請求項37】 前記処理手段は、前記流動体に化学反応を生じさせる物質を、前記液滴に供給可能に構成される請求項22に記載の基板製造装置。

【請求項38】 前記処理手段は、前記液滴の属性を検 出する可能に構成され、

前記制御手段は、前記処理手段により検出された前記液 液の属性に基づいて、前記インクジェット式記録へッド かの同能液滴の吐出および前記駆動手段による駆動を 制御する請求項22に記載の基本販製造装置、

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はインクジェット式配 録ヘッドの工業的応用に係り、特にインクジェット方式 によって任意のパターンを形成するための製造技術に関

[0002]

【従来の技術】半導体プロセス等で用いる基板はシリコン等で構成されている。従来、当該シリコン基板から集 初回路等を製造するために、リソグラフィー法等が使用 されていた。

[0003] このリソグラフィー法は、シリコンウェハ 上にレジストと呼ばれる感光材を薄く塗布し、ガラス乾 核に写真製版で作成した集積回路パターンを光で焼き付 けて転写する点である。転写されたレジストパターンに イオン等を打ち込んで、配線パターンや楽子を形成して 10 いくものであった。

[0004] 上配リングラフィー法を用いるには、写真 製版、レジスト验布、露光、現像等の工程を必要として いたため、設備の整った半導体工場等でなければ微細パ ターンの作成ができなかった。このため微細パターンの 形成は、複雑な工程管理とコストを要するのが常識であ った。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、超LSIほどの微細パターンまではいかなくても、μmのオーダー 20 のパターンを簡単に、しかも安価にかつ工場等の設備を用いることなく、製造することができるものとすれば、工業的に無限の需要が考えられる。

【0006】ところで、出願人は用紙に印字する技術としてインクジェット方式に技術的蓄積がある。インクジェット方式ではインクを吐出させるためにインクジェット式配録ヘッドを使用する。このヘッドはインクをノズル穴から吐出可能に構成され、ノズル穴からインクを用紙上に吐出することによって印字を行うものであった。いままでインクジェット方式の応用は主として印字を目 20的とするプリンタに用いられてきた。

【0007】インクジェット式記録ヘッドは粘性が低い 流動体であれば任意の流動体を吐出可能である。しかも このインクジェット式記録ヘッドの解像度は、例えば4 00bpiと微細である。このためインクジェット式記録ヘッドの個々のノズル穴から工業的用途に使える流動 体を吐出できれば、μmオーダーの観で任意のパターン が形成できると考えられる。インクジェット方式によれ ば、工場のような股備を必要としない。

【0008】しかし流動体によるパターン形成には流動 40 体をパターンとして定着させるための関連処理が必要になるため、インクジェット式配験ヘッドから流動体を吐出可能に構成するのみではパターンを形成することができない。例えば、基板にパターンを定着させるためには、流動体から工業材料を出現させるための化学的処理、パターンの形を整えるための物理的処理、あるいはパターン形成関域にパターン材料を正しく定着させるための物理化学処理が必要になる。

【0009】ただし流動体に対して処理をするとはいって、大がかりな製造装置を使用するのでは、手軽にパタ 50

ーンを形成することを目的としたインクジェット方式に よる基板製造の利点が生かせない。

[0010]

【課題を解決するための手段】そこで、本願発明者はイ ンクジェット方式によってパターン形成を行うにあた り、インクジェット式配録ヘッドの前後またはヘッドか ら吐出された瞬間に、パターン形成に必要な処理を完遂 させる技術を考案した。

【0011】すなわち本発明の第1の課題は、基板上に 減動体が吐出される前に処理可能とすることによりパタ 一ンを形成可能とする方法およびその製造装置を提供す ることである。

【0012】本発明の第2の課題は、基板上に流動体が 吐出された後に処理可能とすることによりパターンを形成可能とする方法およびその製造装置を提供することで ある。

【0013】本苑明の第3の課題は、流動体が吐出された瞬間に処理可能とすることによりパターンを形成可能とする方法およびその製造装置を提供することである。 【0014】上配第1の課題を解決する発明は、インクジェット式配録へッドより所定の流動体を基板上に吐出して任意のパターンを形成するパターン形成方法であって、前配流動体の吐出前に予め前配基板上に一定の処理を行うステップと、前記処理をした基板上に前記インクジェット式配録へッドより前記流動体を吐出するステップと、を確える。

(0015) ここで、流動体とはインクのみならず工業 的用途に用いることができ、ノズルから吐出可能な粘度 を備えた媒体をいう。水性であると油性であるとと問わ ない。ノズル等から吐出可能と流動性(粘皮)を備えて いれば十分で、個体物質が混入していても全体として流 動体であればよい。インクジェット式記録ペッドは、圧 電体案子の体積変化により流動体を吐出させる方式であ っても、熟の印加により急激に蒸気が発生することによ り流動体を吐出させる方式であってもよい。一定の処理 とは、化学的処理でも、物理的処理でも、物理化学的処理でも、物理化学的処理でも、物理の化学的処理でも、物理でもとい、これら定義は以下同様に用いる。

[0016]上配第2の課題を解決する発明は、インク ジェット式配線へッドより所定の流動体を基板上に吐出 して任意のパターンを形成するパターン形成方法であっ て、インクジェット式配線へッドより所定の流動体を基 板上に吐出するステップと、流動体が吐出された基板に 一定の処理を行うステップと、を備るる。

【0017】上記第3の課題を解決する発明は、インク ジェット式記録へッドより所定の流動株を基板上に吐出 して任意のパターンを形成するパターン形成方法であっ て、インクジェット式記録へッドより所定の流動体を吐 出するステップと、インクジェット式記録へッドより吐 出された流動体が基板に到達する前までに、当該吐出さ れた流動体の液滴に一定の処理を行うステップと、を備 える。

【0018】例えば上記処理は、流動体に化学的作用を 及ぼす処理である。化学的作用とは、物質に折出や化学 反応等をいう。例えばこの処理は、流動体に含まれる所 定物質の溶解度を低下させ、当該物質を折出させる処理 である。この処理は、例えば熱風吹き付け、レーザ照 射、ランブ照射、減圧、雰囲気変化(温度はよびミス

7

別、フンフ無料、拠止、券面気変化(温度およいミスト) を基板または流動体に与えることにより得られるものである。またこの処理は、流動体に化学反応を生じさせる物質を基板に吐出する処理である。またこの処理は、液滴にエネルギーを供給し、当該液滴の軌道を由げる処理である。さらにこの処理は、液滴にエネルギーを供給し、当該液滴の軌道を曲げる処理である。

【0019】例えば上記处理は、流動体に物理的作用を 及ぼす処理である。物理的作用とは、流動体に力学的、 電気学的、磁気学的な影響を及ぼすことをいう。この処 理は、例えば、パターン形成領域の境界に沿って吐出さ れた流動体の境界を整形する処理である。またこの処理 は、パターン形成領域に沿って吸収体を移動させること により、過剰な流動体を吸収体に吸収させる処理であ る。

【0020】例えば上記処理は、流動体に物理化学的作 用を及ぼす処理である。物理化学的処理とは、物理的作 用と化学的作用の相互から流動体の挙動に影響を与える ことをいう。この処理は、例えば基板のうちパターン形 成領域の周囲を流動体に対し非親和性に表面改質する処 理である。またこの処理は、基板のうちパターン形成領 域を流動体に対し親和性に表面改質する処理である。こ こで非親和性とは、流動体に対する相対的に接触角が大 きい性質をいう。親和性とは、流動体に対する接触角が 30 相対的に小さいことをいう。これらの表現は、流動体に 対する膜の挙動を明らかにするために、親和性と対比し て用いられるものである。この処理は、基板のうちパタ ーン形成領域を、流動体を吸収する吸収層に表面改質す る処理である。さらにこの処理は、パターン形成領域の 周囲に流動体が流出することを防止するためのバンクを 形成する処理であり、パターンの形成後当該バンクを除 去する工程をさらに備える。さらにまたこの処理は、既 に流動体が吐出されているパターン領域に沿ってさらに 同一の流動体を吐出する処理である。さらにまたこの処 40 理は、流動体に化学反応を生じさせる物質を、液滴に作 用させる処理である。また、この処理は、液滴の属性を 検出する処理であって、検出された液滴の属性に基づい て、インクジェット式記録ヘッドからの液滴の叶出を制 御するステップをさらに備える。

【0021】本発明は、所定の流動体により基板上に任 整のパターンを形成するための基板製造装置であって、 流動体を基板上に吐口可能に構成されたインジェット 式配録ヘッドと、基板上に一定の処理を行う処理手段 と、インクジェット式記録ヘッドおよび処理手段と基板 50

との相対位置を変更可能に構成される駆動手段と、イン クジェット式記録へッドからの流動体の吐出、処理手段 による処理および駆動手段による駆動を制御する制御手 段と、を備える。そして制御手段は、処理手段による処 理をインクジェット式記録ヘッドからの流動体の吐出に 先行して行わせることが可能と構成される。

【0022】また本発明は、所定の流動体により基板上 に任意のパターンを形成するための基板製造装置であっ て、流動体を基板上に吐出可能に構成されたインクジェ ット式記録へッドと、基板上に一定の処理を行う処理手 段と、インクジェット式記録へッドおよび処理手段と基 板との相対位置を変更可能に構成される駆動手段と、イ ンクジェット式記録へッドからの流動体の吐出、処理手 段による処理および駆動手段による駆動を制御する制御 手段と、を備える。そして制御手段は、インクジェット 式記録へデケからの流動体の中出や処理手段による処理

【0023】本発明は、所定の流動体により基板上に任意のパターンを形成するための基板製造装置であって、

に先行して行わせることが可能に構成される。

流動体を基板上に吐出可能に構成されたインクジェット 式記録へッドと、インクジェット式記録へッドから吐出 された流動体の液滴が基板に到達する前に当該液顔に一 定の処理を行う処理手段と、インクジェット式記録へ ドおよび処理手段と基板との相対位置を変更可能に構成 される駆動手段と、インクジェット式記録へッドからの 流動体の吐出、処理手段による処理および駆動手段によ る駆動を削御する制御手段と、を備える。

【0024】例えば上記処理手段は、流動体に化学的作用を及ぼすことが可能に構成される。

「0025]また処理手段は、流動体に含まれる所定物質の溶解度を低下させ、当該物質を析出させることが可能に極めされる。

【0026】さらに処理手段は、流動体に化学反応を生じさせる物質を基板に吐出することが可能に構成され

【0027】さらにまた処理手段は、流動体に物理的作用を及ぼすことが可能に構成される。

【0028】また理手段は、パターン形成領域の境界に 沿って吐出された流動体の境界を整形可能に構成され ス

【0029】さらに処理手段は吸収体を備え、制御手段 はバターン形成領域に沿って吸収体を相対的に移動させ ることにより、過剰な流動体を吸収体に吸収させる。

【0030】さらにまた処理手段は、流動体に物理化学 的作用を及ぼすことが可能に構成される。

【0031】また処理手段は、基板のうちバターン形成 領域の周囲を流動体に対し非規制性に表面改質すること が可能に構成される。非親和性とは、流動体に対する制 対的に接触角が大きい性質をいう。この表現は、流動体 に対する膜の挙動を明らかにするために、親和性と対比 して用いられるものである。

【0032】さらに処理手段は、基板のうちパターン形成領域を流動体に対し貌和性に表面改質することが可能 に構成される。ここで、親和性とは、流動体に対する接触角が相対的に小さいことをいう。

【0033】さらに処理手段は、基板のうちパターン形成領域を、流動体を吸収する吸収層に表面改質することが可能に構成される。

【0034】さらにまた処理手段は、パターン形成領域 の周囲に流動体が流出することを防止するためのパンク を形成可能に構成され、当該製造装置は、パターンの形 成後当該パンクを除去する手段をさらに備える。

【0035】本発明は、所定の流動体により基板上に任 窓のパターンを形成するための基板製造装置であって、 流動体を基板上に吐出可能に構成されたインクジェット 式記録ヘッドと、インクジェット式記録ヘッドと基板上 との相対位置を変更可能に構成される駆動手段と、イン クジェット式記録へッドからの流動体の吐出および駆動 手段による駆動を削削する削御手段と、を備える。そし て制御手段は、既に流動体が吐出されているパターン倒 域に沿ってインクジェット式記録ヘッドからさらに同一 の活動体を中出する。

【0036】例えば処理手段は、液滴にエネルギーを供給し、当該流動体の濃度を上昇させることが可能に構成される。

[0037] また処理手段は、液滴にエネルギーを供給 し、当該液液の軌道を曲げることが可能に構成される。 [0038]さらに処理手段は、流動体に化学反応を生 じさせる物質を、液滴に供給可能に構成される。

【0039】さらにまた処理手段は、液滴の属性を検出 する可能に構成され、制御手段は、処理手段により検出 された液滴の属性に基づいて、インクジェット式配録へ ットからの液液の吐出および駆動手段による駆動を制御 する。

[0040]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施するための最 良の形態を、図面を参照して説明する。

【0041】(共通構成)図1に以下の各実施形態で用いる基板製造装置の共通部分の概念構成図を示す。図1 に示すように、本基板製造装置100は、インクジェッ 40 ト式記録へ、ド2、処理装置3、架動機構4および制御 回路5を備えている。以下の各実施形態では、処理装置 3の配置と処理内容がそれぞれ異なり、残りの構成は各 実施形態にほぼ共通して使用をわる。

【0042】インクジェット末記録〜ッド2には、流動 体10が入れられたインクタンク26がパイプ27を介 して流動体10を供給可能に接続されている。流動体1 0としては、インクジェット式記録〜ッドから吐出可能 な流動性を呈するものならば、親水性であると非親水性 であるとを問わずあらゆるものが適用可能である。構成 90 物全部が液状でなくともよい。例えば導電性を示す金属 を微粒子として溶剤中に混入させたものでもよい。

【0043】まずインクジェット式記録ヘッドの構造を説明する。図18はインクジェット式記録ヘッド2の分解斜視図である。インクジェット式記録ヘッド2は、一般的なインクジェット式記録ヘッドとは、正統のないに構成されていれば十分である。図18のインクジェット式記録ヘッド2では、ノズル211の設けられた圧力流がプレート21、および振動板23の設けられた圧力流基板22と、筐体25に嵌め込んで構成される。圧力室基板22は、例えばシリコンをエッチングして形成され、キャビティ(圧力室)221、側壁222はおりサザーバ223等が形成されている。

【0044】図19にノズルプレート21、圧力室基板 2.2および援動板9.3を積屑して構成されるインクジェ・ ット式記録ヘッド2の主要部構造の斜視図一部断面図を 示す。同図に示すように、インクジェット式記録ヘッド 2の主要部は、圧力室基板22をノズルプレート21と 振動板23で挟み込んだ構造を備える。 ノズルプレート 21は、圧力室基板22と貼り合わせられたときにキャ ピティ221に対応する位置に配置されるように、ノズ ル穴211が形成されている。圧力室基板22には、シ リコン単結晶基板等をエッチングすることにより、各々 が圧力室として機能可能にキャビティ221が複数設け られる。キャビティ221間は側壁222で分離されて いる。各キャピティ221は、供給ロ224を介して井 通の流路であるリザーバ223に繋がっている。振動板 23は、例えば熱酸化膨等により構成される。振動板 2 3上のキャビティ221に相当する位置には、圧電体素 子24が形成されている。また、振動板23にはインク タンクロ231が設けられ、タンク26から任意の流動 体10を供給可能に構成されている。圧電体素子24 は、例えばPZT素子等を上部質極お上び下部質極(図 示せず)とで挟んだ構造を備える。圧電体素子24は、 制御回路5から供給される制御信号Shに対応して体積 変化を生ずることが可能に構成されている。

【0045】なお上記インクジェット式記録ヘッドは圧電体素子に体積変化を生じさせて流動体を吐出させる構成であったが、発熱体により流動体に熱を加えその膨張。 によって液滴を吐出させるようなヘッド構成であってもよい。

【0046】処理装置3は、基板1に対して所定の処理 を施すことが可能に構成されている。処理装置3は制御 回路5から供給される制御信号5pに対応して処理を行 う。処理装置3の機能、構造に関しては、以下の各実施 形飾で明らかにする。

【0047】駆動機構4は、モータM1、モータM2お よび図示しない機構構造を備えており、インクジェット 式配録ヘッド2および処理装置3をともに、X輪方向 (図1の横方向)およびY軸方向(図1の奥行き方向) に搬送可能に構成されている。モータM1は駆動信号S xに応じてインクジェット式記録ヘッド2および処理装置3をX軸方向に搬送可能に構成される。モータM2は 駆動信号Syに応じてインクジェット式記録ヘッド2お よび処理装置をY軸方向に搬送可能に構成される。

【0048】なお、駆動機構はは基板1に対するインクジェット式配験へッド2および処理装置3の位置を相対的に変化可能な構成を備えていれば十分である。このため上記構成の他に、基板1がインクジェット式配録へッド2や処理装置3が1とがともに動くものであっても、インクジェット式配録へッド2および処理装置3が1ともに動くものであってもよい。また、処理の形態によっては処理装置3がイングジェット式配録へッド2とともに娩送される必要はなく、処理装置3が別のに接送されても、静止しているものであってもよい。

【0049】図21を参照してインクジェット式記録へッド2の吐出原理を示す。同図は図20のA-Aの線における断面図である。流動体10は、タンク26から、援験板23に設けられたインクタンクロ231を介してリザーバ223内に供給される。流動体10は、このリザーバ223から供給ロ24を通して各キャビティ221に流入する。圧電体菓子24は、その上部電極と下部電機との間に電圧を加えるとその体積が変化する。この体積変化が援動板23を変形させ、キャビティ21の体積を変化が援動板23を変形させ、キャビティ21の体積を変化が援動板23を変形させ、キャビティ21の体積を変化させる。

【0050】制御信号Shが供給されず、電圧を加えない状態では援助板23の変形がない。制御信号Shが供給され電圧が加えられると、同國の破棄で示す位置まで援助板23bや変形後24bの圧電索子が変形する。キャビティ21内の体質が変化すると、キャビティ21に30流された流動体10の圧力が高まる。ノズル穴211には流動体12が供給され、液積11が吐出される。

【0051】 (配置の態様) 図2乃至図4を参照して本 発明の基本的な処理の配置をそれぞれ説明する。本発明 はインクジェット式記録へッドから吐出された流動体に 行う処理装置の配置を3つに区別して考える。

【0052】図2はインクジェット式記録ペッドから流動体を吐出する前に基板に対して処理を行う第1の配置
町銀念図である。同図に示すように、インクジェット式 記録ヘッド2および処理装置3は矢印搬送方向に相対的
に搬送される。第10配置の場合、処理装置3は池行方 向に対してインクジェット式記録ヘッド2より前に配置 される。そして基板1に対しインクジェット式記録ヘッド2から流動体の破額11が吐出される前に基板1に対して所定の処理7を行うものである。処理の詳細は以下 の実施形態で説明する。

【0053】図3はインクジェット式記録ヘッドから流 動体を吐出した後に流動体または基板に対して処理を行 う第2の配置の概念図である。同図に示すように、イン クジェット式記録ヘッド2および処理装置3は矢印機送 50 方向に相対的に搬送される。第2の配配の場合、処理装置 3 は進行方向に対してインクジェット式配線へッド 2 より後に配置される。そしてインクジェット式記線へッド 2 から基板 1 に対し 1 流動体の被滴 1 1 が吐出された後に基板 1 に対して所定の処理、を行うものである。処理の詳細は以下の実施形態で設明する。

【0054】図4はインクジェット式記録ヘッドから吐

出された流動体の液滴に直接処理を行う第3の配置の概 念図である。第3の配置の場合、処理装置3はインクジ エット式配録へッド2から吐出された液滴11に対して 直接処理可能に配置される。そしてインクジェット式記 録へッド2から吐出された流動体の液滴11が基板1に 到達する前に、当該液滴11に対して所定の処理7を行

【0055】(実施形態1) 本発明の実施形態1は化学 的作用(溶解度低下)を流動体に及ぼす処理に関し、主 に上記第1の配置および第2の配置において用いられ

うものである。処理の詳細は以下の実施形態で説明す

【0056】図5に本実施形態1の処理概念を説明する側面図を示す。本実施形態1の処理装置301は、流動体11が吐出される前の基板1に対して、流動体に混入している物質の溶解度を低下させ、その固形分を折出させる処理701を適用可能に構成されている。このような処理として、熱風の吹き付け、レーザ限射、ランブ照射等を行って流動体の溶媒成分を蒸発させるといった処理が考えられる。同図は第1の配置に適用した構成を示すが、第2の配置に適用した場合には処理装置301がインクジェット式記録ヘッド2の進行方向後方に配置される。

【0057】熱風の吹き付けを行う場合、処理装置30 1は空気を吹き付けるコンプレッサおよび空気を熱する ヒータ等を備える。レーザ照射を行う場合には、所定の 該長のレーザ光を照射するレーザ発光用ダイオード、レ ーザ光を集光するためのレンズ群およびレンズ群を駆助 して適正にレーザ光を基板上に集光するためのアクチュ エータ装置等を備える。ランブ照射を行う場合は、キセ ノンランプ等の高エネルギーを放射可能なランプ、リフ レクタ、レンズ群等を備える。

【0058】前処理を行う第1の配置で上記処理装置3 01を用いる際、上記処理を流動体の液滴11が吐出さ れる直前の基板1に対して行う。基板に着弾した液滴 は、すでに基板1が熱せられているので、着弾直後から 溶漿成分が蒸発し、流動体が濃縮される結果として、因 形が残留あるいは溶解物が折出するようになる。例え ば流動体が溶媒中に金属の微粒子を含んだものであれ ば、熱の影響で溶媒成分のみが蒸発し、金属微粒子を導 電性のパターンとして基板上に残留させることができ る。

【0059】後処理を行う第2の配置で上記処理装置3

01を用いる際、既に基板上に吐出された流動体の液滴 に対して上記処理を行う。同様の作用により溶解物を析 出させることができる。

【0060】なお、上記処理の他に、局所的に減圧させたり雰囲気を変更可能に構成してもよい。このように構成 成すれば、流動体に対する影響物の溶解度を低下させ、 結果として溶解物を折出させることが可能となる。また 基板全体を熱する等の措置も未実施形態の一変形例に加 えられる。このためには基板1の報置台にヒータ装置等 を設けることになる。

【0061】上記のように木実施形態1によれば、エネルギーを加えることにより流動体から固形物質を残留あるいは折出させることができ、パターン形成が容易に行える。また処理装置によって局所的に加熱するのみで済むので、加熱設備が小さくて済み、消費エネルギーを低く抑えることができる。

【0062】(実施形態2) 木発明の実施形態3は化学的作用(化学反応)を流動体に反す 大型原則、主に起第1の配置はおいて用いられる。【0063】図6に本実施形態2の処理概念を説明する側面図を示す。本実施形態2の処理製置302は、流動体11が吐出される前の基板1に対して、流動体に対して学反応や分散系の破験をもたらす反応液702を吐出可能に構成されている。処理装置302としてはインクジェット式配録へッド2と同様な構成を用いることが昇しい、流動体の技術11とほぼ同量の反応液を制御しながら吐出させることができるからである。同図は第1の配置に適用した場合には処理装置302がインクジェット式配録へッド2の配置に適用した場合には処理装置302がインクジェット式配録へッド2の過程に適用した場合には処理装置302がインクジェット式記録へッド2の過行方向後方に配置される。

[0064]分散系の破壊をもたち地理として、流動体の液滴11がスチレンーアクリル樹脂により分散した 有機面料を主成分とする場合に、反応液702として耐酸マグネシウム水溶液を吐出する場合が挙げられる。また化学反応をもたらす処理として、流動体の液滴11がエポキシ樹脂を主成分とする場合に、反応液702としてアミン類を吐出する場合が挙げられる。

【0065】前処理を行う第1の配置で上記処理装置3

02を用いる際、流動体の接着11が吐出される前のパクーン形成領域に対して上記反応後702を吐出する。 反応後702が吐出されたパターン形成領域上に接着11が着弾すると、分散系の破壊あるいは化学反応が生 し、固形物質13が折出する。例えば接着11が金属塩を含む場合、この塩と反応可能な反応で10を形成でる人の2を用いることにより、導電性のある金属パターンを形成できる。 【0066】後処理を行う第2の配置で上記処理装置3を用いる際、既に基核上に出出された流動体の液滴11にり固形物質13を生成させることができる。

【0067】なお上記実施形態ではインクジェット式記 50

録ヘッドを2個使用したが、さらに複雑な反応を生じさせるためには、他の反応液を吐出可能なヘッドを増やしていけばよい。

[0068]上記したように実施形態2によれば、反応 酸により分散系の酸膜や化学反応を生じさせるので、イ ンクジェット式配験へッドと複数装備するだけでパター ンを形成できる。特に同様な構成のヘッドを複数設け、 そこから吐出させる物質のみを変えればよいので、製造 装置の設計が容易である。

【0069】(実施形態3)本発明の実施形態3は物理 化学的作用として基板の親和性を改善する処理に関し、 主に上記第1の配置において用いられる。

【0070】図7に本実施形態3の処理概念を説明する 平面図を示す。本実施形態4の処理装置303は、流動 体11が吐出される前の基板1のパターン形成領域を、 流動体に対し親和性を備えるように表面改質可能に構成 されている。

【0071】 銀和性を備えるように表面改質する処理としては、流動体が極性分子を含む場合(水分を含む場合等)は、シランカップリング利を塗布する方法、酸化アルミニウムやシリカ等の多孔質膜を形成する方法、アルゴン等で逆スパッタをわける方法、コロナ放低処理、ブラズや処理、紫外線解射処理、オンシ処理、股前処理等、公知の種々の方法を適用する。流動体が極性分子を含まない場合には、パラフィン等を塗布する方法、ガスプラズや処理、カップリング処理等がある。

【0072】シランカップリング剤を用いる場合には、 処理装置303は、無機質と反応しやすいアルコキシ基 やハロゲンなどの加水分解性の置換基と有機質と反応し やすいビニル基、エポキシ基、アミノ基等とをともに持 つ有機ケイ素化合物 (シランカップリング剤) を塗布可 能に構成される。塗布方法としては、インクジェット式 記録ヘッドからの材料叶出やボールペン類似の涂布機様 による直接塗布が考えられる。多孔質膜を形成する場合 には、処理装置303は多孔質材料、例えばA12O3や シリカを塗布可能に構成される。塗布方法は上記と同様 である。逆スパッタをかける方法の場合には、処理装置 303としてスパッタリング装置を適用する。すなわち カソード、基板をアノードにする電極、アルゴン雰囲気 調整機構および電源等を備える。逆スパッタ処理によ り、基板の表面が活性化され、親水性の置換基に置き換 わり、基板表面が改質される。コロナ放電を行う場合に は処理装置303として高電圧放電用電極を備え、基板 1に接地電圧を印加可能に構成する。基板表面に高電圧 が局所的に印加されることにより基板の有機分子の一部 が親水性のある基に置き換わり表面改質される。プラズ マ処理をするには、処理装置303として気体放電で生 じたプラズマを噴出可能に構成する。紫外線を照射する

場合には、処理装置303として紫外線照射用ランプを

備える。オゾン処理を行う場合は、処理装置303とし

16

てオゾンの流通する雰囲気下で所定の電圧を印加し、活性化したオゾンを基板に放射可能に構成する。 脱脂処理を行う場合には、処理装置 30 3として、基板上に過せ、ガガ酸、クロム酸、 超酸、 硝酸等の強アルカリを供給可能に構成する。パラフィン等を塗布する場合には、処理装置 30 3にボールペン類似の塗布機構を使用し、パターン形成領域の両辺を中心とする領域に溶解したパラフィン等を塗布する。

【0073】上記処理装置303を備えたので、シラン カップリング剤を塗布した場合には、パターン形成領域 10 703に塗布されたシランカップリング剤が基板材料と 密着し、一方で水に対して濡れ易い基が表面に露出す る。多孔質膜を形成した場合には、パターン形成領域7 03に形成された酸化アルミやシリカ等の膜が多孔質で あるため流動体を含み易くなる。逆スパッタを行った場 合にはパターン形成領域の表面温度が上昇し膜の付着力 を向上させたり親水性際に変えたりできる。コロナ放雷 を行った場合には、基板表面にOH基やCOOH基が生 成するため親水性を備えるようになる。プラズマ処理を 行った場合、基板表面の高分子の未反応基と架橋層を生 20 ずる。未反応基は容易に酸化され、OH基やC=O基。 CHO基、COOH基等が発生し親水性を備えるように なる。ポリエステルやポリプロピレンを使用した基板等 に紫外線照射を行った場合、OH基やCOOH基を生成 して親水性を備える。ABSやポリプロピレン等にオゾ ン処理を行った場合には、表面の親和性が改善される。 脱脂処理を行った場合には、基板表面が酸化され親水性 の基に置換され親水性を示すようになる。パラフィン等 の塗布処理を行った場合には、塗布された領域が非極性 分子に対し親和性を示すようになるため、流動体が非極 性分子である場合に濡れ易くなる。

【0074】上記実施形態3によれば、インクジェット 式記録ヘッド2からの補勤体の吐出に先行して表面改質 されたパターン形成領域703に親和性を示す膜が形成 されるので、パターン形成領域に着弾した被滴12が広 がり過ぎたり分離したりするおそれが少なくなる。

【0075】 (実施形態4) 本発明の実施形態4は物理 化学的作用としてパターンの両側に非親和性領域を設け る処理に関し、主に上記第1の配置において用いられ る。

【0076】図8に本実施形態4の処理概念を説明する 平面図を示す。本実施形態4の処理装置304は、基板 1のパターン形成領域外側の領域に流動体に対し非親和 性を示す版704を形成可能に構成されている。

[0077] 非規和地を示す順を形成する処理として は、流動体が極性分子を含む場合には上配したパラフィ ン等を詮布する方法等が挙げられる。流動体が極性分子 を含まない場合には、上記実施形態3で説明したシラン カップリング剤を整布する方法、版化アルミニウムやシ リカ等の多孔質膜を形成する方法、アルゴン等で逆スパ 50 ッタをかける方法、コロナ放電処理、プラズマ処理、紫 外線照射処理、オソン処理、脱脂処理等、公知の種々の 方法を適用する。

【0078】 非極性分子に対し非親和性を示す膜や、極性分子に対し親和性を示す膜の形成方法については上記 実施形態3と同様なので説明を省略する。

[0079] 上記したように実施形態4によれば、イン クジェット式記録へッド2からの流動体の吐出に先行し てパターン形成領域の両側に流動体に対し非親和性をデ す膜704が形成されるので、パターン形成領域からは み出た流動体は非親和性膜704ではじかれるため、流 動体をパターン形成領域に収めることができる。

【0080】(実施形態5)本発明の実施形態5は物理 化学的作用としてパターン形成領域を、流動体を吸収可 館に形成に形成する処理に関し、主に上記第1の配置に おいて用いられる。

【0081】図9に本実施形態5の処理概念を説明する 側面図を示す。本実施形態5の処理装置305は、基板 1のパターン形成領域に流動体を吸収する吸収層705 を形成可能に構成されている。

【0082】吸収層705としては、ポリビニルアルコ ール (PVA)、ポリ酢酸ビニハ等を適用することが可 能理装置305はボールペン類似の塗布機構を備えること が考えられる。

【0083】上記構成において、処理装置305が流動体の吐出に先行して吸収層705を形成し、形成された 収収層705の上にインクジェット式記録ペッド2から流動体の被摘11が吐出される。吐出された流動体の液滴11のうち一部は吸収層705に吸収されて層14内に流動体が定着する。このため吸収層を形成した領域にバターンが形成されることになる。

【0084】本実施形態5によれば、インクジェット式 記録ヘッド2からの流動体の吐出に先行して処理装置3 05が吸収層を形成するので、吸収層の通りにパターン 形成が行え、過剰な流動体を吸収層に吸収させることが できる。

【0085】 (実施形態6) 本発明の実施形態6は物理 化学的作用としてパターン形成領域の境界付近に流動体 の流出を抑えるパンク (土手状のもの)を形成する処理 に関し、主に上記第1の配置において用いられる。

【0086】図10に本実施形態6の処理概念を説明する平面図を示す。本実施形態6の処理装置306は、基板1のパターン形成領域の境界付近に流動体の流出を防止するパンク706を複数形成可能に構成されている。処理装置306としては、パンクの材料を一定の高さで形成する必要があるため、ボールペン類似の塗布機構を複数用いる。各盤布機構はパターン形成領域の幅方向にその幅だけ離れて配置される、ソンク706の材料としては、ポリイミド、アクリル・樹脂、エポキャ樹脂等が表しては、ポリイミド、アクリル・樹脂、エポキャ樹脂等がより

【0087】上記構成において処理装置306は流動体 の吐出に先行してバンク706を形成していく。バンク の形成後にバターン形成領域に流動体の液滴11が吐出 されるとバンク706が存在するためにバンク外に流動 体が適出していくことはない。流動体は二つのバンクに

囲まれたバターン形成領域内で固化する。

えられる。

【0088】なお、流動体が固化した後にバンク706 を取り除く工程を設けることは好ましい。流動体がパタ ーンとして定着すればパンクは不要になるからである。 パンクの除去にはプラズマアッシング、エッチング等の 方法を用いる。

[0089]本実施形態6によれば、インクジェット式 記録ヘッドからの流動体の吐出に先行してバンクを形成 するので、流動体がパターン形成領域外に流出すること を防止できる。パターンの定着後にパンクを取り除け ば、パターンの偏を狭く維持できる。

【0090】(実施形態7)本発明の実施形態7は物理的作用として吐出された流動体を整形する処理に関し、主に上記第2の配置において用いられる。

【0091】図11に本実施形態7の処理概念の説明図を示す。(a)は平面図、(b)は側面図を示す。本実施形態7の処理装置310は、基核1に着弾した遮動体12をパターン形成領域の境界に沿って振る針状部材710を複数備えている。各針状部材710にパターン形成領域の幅方向にその幅だけ離れて配置される。針状部材710としては、一定の機械的強度がある一方、基板に損傷を与えない程度の弾性があることが好ましい。このため針状部材710は樹脂、ゴム、柔らかい金属等の材料で構成する。

【0092】上配構成においてインクジェット式記録へ ッド2が流動体を基板に担出するとわずかながら吐出方 向の誤差を含みながらパターン形成領域の延在方向に 沿いながらもその境界がパターン形成領域からはみ出す 部分がある。処理装置310は、このようにはみ出した 流動体12をパターン形成領域からはみ出す ないながらもでの境界がパターン形成領域からはみ出す にはみ出した 流動体12をパターン形成領域の境界に沿って くので、はみ出した部分がパターン形成領域内に戻さ れ、一定の個のパターン15が形的される。

【0093】本実施形態7によれば、インクジェット式 40 配録ヘッド2から吐出された流動体の接摘の着弾位置が ずれていても、その後に処理装置310がパターンを整 形していくので、整ったパターンが形成できる。

【0094】(実施形態8) 本発明の実施形態8は物理 的作用として着弾された流動体のうち過剰分を吸収する 处理に関し、主に上配第20配置において用いられる。 【0095】図12に本実施形態8の处理概念の説明図 である。(a)は平面図、(b)は側面図を示す。本実 施形態8の処理装置311は、パケーン形成領域に沿っ て移動し基板1に着弾した流動体12の過剰分を吸収可 90 能に構成された吸収部材711を備えている。吸収部材711としては、過剰な流動体を吸収可能なパイプ形状をしていることが好ましい。この吸い取った流動体を再びインクジェット式配録へッド2から吐出可能に構成してもよい。吸収部材711は、一定の機械的強度がある一方、基板に損傷を与えない程度の弾性があることが好ましい。このため針状部材は樹脂、ゴム、乗らかい金属等の材料で機合する。

18

【0096】インクジェット式記録ヘッド2からは若干 過剰に流動体を吐出した方がパターンの分断が生じにく い。しかし過剰な流動体の液滴が着弾すると必要なパタ ーン形成領域外に広がる。本実施形態では流動体の液滴 が基板に着弾された直後に処理装置311の吸収部材7 11が過剰な流動体を吸収していくことになる。このた めパターン形成態域以外に流動体が広がることがない。 また吸収した流動体を再びインクジェット式記録ヘッド 2に供給すれば流動体材料を節減することができる。

【0097】(実施形態9) 本発明の実施形態9は物理 的作用として時間差で洗動体を吐出する処理に関し、主 に上記第1の配置および第2の配置において用いられ る。

【0098】図13に本実施形態9の処理概念を説明する側面図を示す。本実施形態9は、处理装置としても流 動体を吐出可能に構成されたインクジェット式記録へッ よを備えている。すなわち同一の流動体を吐出すること ンクジェット式記録へッド2が所定の距離をおいて配置 され、相前後して同一のパターン形成領域に流動体を吐 出可能に構成されている。

【0099】上記構成において先行するインクジェット 式記録ヘッド2aは、若干の間隔をおいて流動体の着弾 跡12aがパターン形成領域上に配置されるように液滴 11 a を吐出する。後続するインクジェット式記録ヘッ ド2bでは、既に着弾している流動体12aと合わせて バターン形成領域が流動体で満たされる程度の量に調整 して流動体の液滴12bを叶出する。先に着弾した流動 体12aには表面張力が作用しており、後から着弾する 流動体12bにも表面張力が作用する。表面張力が作用 している液滴上に他の液滴が落ちると、表面張力故に瞬 時に二つの液滴が混ざらず、後から落ちた液滴は先に着 弾した液滴上を滑ってその周辺に落ちる。したがって本 実施形態では先に所定の間隔をおいて流動体12aが着 弾しているため、後から吐出された流動体の液滴11b は、先に着弾した流動体12aの存在しない領域に着弾 する。このためパターン形成領域には隙間なく流動体が 着弾し、その密度も一定になる。

【0100】なお、上記形態は、インクジェット式記録 ヘッド2を一個のみ設け、同一のパターン形成領域を往 復可能に制御回路5を構成してもよい。時間差で流動体 が吐出される点で同一の効果が得られるからである。こ の場合、ヘッドの個数を削減できるという効果を奏す る。

【0101】本実施形態9によれば、時間差で同一の流 動体を吐出するので、基板に着弾する流動体の密度を均 一することができ、均一な厚みのパターンを形成でき る。

【0102】 (実施形態10) 本発明の実施形態10は 化学的作用としてレーザ照射により液滴の濃度を上げる 処理に関し、主に上記第3の配置において用いられる。 【0103】図14に本実施形態10の処理概念を説明 する側面図を示す。本実施形態10において処理装置3 20は第3の配置を採り、インクジェット式記録ヘッド 2から吐出される流動体の液滴11の側面からこの液滴 にレーザ光720を照射可能に構成されている。 すなわ ち処理装置320はレーザ光を照射するために図示しな いレーザ発光用ダイオード、レンズおよびアクチュエー タを備える。レーザ発光用ダイオードはエネルギー源と して所定の短波長のレーザ光を発光し、レンズはこのレ ーザ光を液滴上に集光可能に構成される。アクチュエー タは液滴11に正しくレーザ光720が焦点を結ぶよう にレンズおよびレーザ発光用ダイオードの位置補正を行 20 うことが可能に構成されている。

【0104】なお、瞬時にエネルギーを与える手段としてはレーザ光の照射が好ましいが、エネルギーを被滴に 供給可能であればこれに限定されるものではなく、熱風 供給、ランブ照射、雰囲気提供等が種々の構成を適用で さる。

【0105】上記構成においてインクジェット式記録へッド2から流動体の液滴11が吐出されると、所定位置で処理装置320から射出されたレーザ光720が液滴11上で焦点を結ぶ。これにより液滴11には高いエネルギーが瞬時に与えられる、エネルギーが与えられた液滴11は温度が上昇するため流動体に溶解している物質の濃度が上がったり、含有されている固形分の成膜化が促進されたりする。そして着弾するまでに不要な熔媒成分が減少し、パターン形成に必要な最小限の組成で基板力が減少し、パターン形成に必要な最小限の組成で基板力が減少し、パターン形成に必要なまでは、アターン形成に適当な流動体の格度より低い場合でも、パターン形成に適当な流動体の微度に影響することができる。

式記録へッド2から吐出された被摘 1 が着弾するまで で不要な熔塊成分を除去できるので、基板に着弾する流 動体が過剰に広がるのを防止でき、またパターン形成ま での時間を短くできる。

【0107】(実施形態11)本発明の実施形態11は 物理的作用として流動体の液滴に他の液滴を衝突させて 軌道を曲げる処理に関し、主に上記第3の配置において 用いられる。

【0108】図15に本実施形態11の処理概念を説明 する側面図を示す。本実施形態11において処理装置3 50

21は第3の配置を採り、パターン形成領域の延在方向 に垂直な方向であって、インクジェット式記録ヘッド2 を中心として対向するように配置される。各処理装置3 21は異なる方向から液滴にエネルギーを供給可能に印 加できる構成を備える。エネルギーとして所定の液滴を 衝突させるという力学的エネルギーを加える場合には、 所定の液滴を吐出可能な構成、例えばインクジェット式 記録ヘッド2と同様な構成を備える。所定の液滴とは後 述する化学反応を目的とする場合はその反応を起こさせ る反応液、反応を起こさせたくない場合にはインクジェ ット式記録ヘッド2が叶出するものと同一の流動体を叶 出させる。エネルギーとして空気を用いる場合には、空 気を吹き付けるためのコンプレッサおよびノズル等を備 える。エネルギーとして電界を用いる場合には、流動体 の液滴11の軌道を挟んで両側に電極を設け、両電極間 に電圧を印加する電源を備える。電界を用いる場合。イ ンクジェット式記録ヘッド2から吐出される流動体の液 適11を正または負に帯電させる構成も設ける。

【0109】上記構成においてインクジェット式記録へ ッド2から流動体の液滴11が吐出されると、制御回路 5は処理装置321に制御信号Spを供給して、予め指 定されたパターン領域に流動体が着弾するよう制御す る。処理装置321が所定の液滴を吐出する場合には、 インクジェット式記録ヘッド2からの液滴11の吐出に 同期して処理装置321から液滴が吐出され、基板に着 弾する前に両者が衝突し、液滴の着弾位置が変更され る。処理装置321が空気を噴出する場合にはインクジ エット式記録ヘッド2からの液滴の吐出に同期して空気 が吹き出され、流動体の液滴の軌道が曲げられる。処理 装置321が電界を印加する場合には、まずインクジェ ット式記録ヘッド2からの液滴11を帯雷させ、両電板 間における電界の向きおよびその大きさを制御信号Sp によって調整すれば、陽極方向または陰極方向のいずれ かの方向に任意の変位だけ液滴の着弾位置を変更させる

【0110】上配構成によれば、任意のパターン幅でパターン形成が行える。例えば図15に示すように、パターン幅が最も狭い領域A1では抑御信号を開始を表します。で、流動体の被領11の着弾位置は一定し、最も細いパターンが描ける。一方パターン幅を広くする領域A2では複数の処理装置321に制御信号をpを至しに供給する。制御信号を別えるとエネルギー721aが供給され位置P1に着弾する。例えば制御回路321はに制御信号を加えるとエネルギー721aが供給され位置P1に着弾する。制御回路321bに制御信号を加えるとエネルギー721bが供給され位置P1に着弾する。利力回路321bに制御信号を加えるとエネルギー721bが供給され位置P2に着弾する。インクジェット式記録へッド2に供給する制御信号Shに同期させて制御信号Spを制御回路321aと321bとに交互に供給すれば、液滴11が吐出されることに着弾位置が変化する。その結果として着弾した

場合の直径よりも広い幅のパターン形成領域に流動体を 充填させることができる。

【0111】本実施形態11によれば、制御回路321が出力するエネルギーを制御することで任意のパターン幅でパターンを形成することができる。

【0112】(実施形態12)本発明の実施形態12は 物理化学的作用として流動体の液滴に反応液の液滴を衝 突させて化学反応を促進する処理に関し、主に上記第3 の配置において用いられる。

3 2 2 に制御信号 Spを供給可能に構成される。 【0 1 1 4】上記構成においてインクジェット式記録へ ッド 2 から流動体の液滴 1 が吐出されると、ほぼ同時

ット2かの成別体の政例 11か任出されると、はは同時に反応被 7 2 2 が処理装置 3 2 2 から吐出される。両者は基板 1 に到達する前に接触し化学反応等を生じ、反応中または反応後に基板 1 に着弾する。

【0115】本実施形態12によれば、空中に反応を生 じさせることができるので、吐出時には反応していては 困るが着弾時には反応していることが望ましい場合に適 する。例えば反応すると固化が始まったり腐食性が発生 したりする場合に適用できる。

【0116】 (実施形態13) 本発明の実施形態13は 流動体の液滴の検出と補正処理に関し、主に上記第3の 配置において用いられる。

【0117】図17に本実施形像13のプロック図を示す。同図は図1とほぼ同等の構成を個えるが、処理装置330は、制物信号を引に応じてレーザ光等直逃性のよい光をインクジェット式記録へッド2から吐出40大元後譲11の弾道を横切って対力では、地では、は、処理装置330から射出された光を検出可能に構成され、例えばフォトデックタで構成される。制御回路5は検出手段331からの検出信号を入力し、液滴11の吐出タイミング、位置、方向、速度、大きさ等を検出可能に構成される。そしてインクジェット式記録へッド2の使用による特性変化を制御信号にフォードバック可能に構成される。例えば、吐出タイミングが振弾よりです。

にはそのずれを補償するようにインクジェット式記録へ ッド2の流動体吐出を制御する制御信号Shのタイミン グを補正する。位置や方向がずれている場合には液滴の 着磁位置がずれてしまうので、このずれを補償するよう にモータM1に対する駆動信号SxまたはモータM2に 対する駆動信号Svを供給する。これにより基板1に対 するインクジェット式記録ヘッド2の相対位置が補正さ れ、流動体をパターン形成領域に沿って適正な位置に着 弾させることができる。液滴の速度の検出は、検出信号 Sp2中のパルスの幅に応じて計算する。すなわちフォト デテクタの検出而積が決まっているので、液滴の涌渦に よるパルスの幅が小さければ速度が早く、パルスの幅が 大きければ速度が遅いと考えられる。これらは線形的に 対応する。液滴の速度が基準よりずれた場合、基準時よ り早くまたは遅く液滴が基板に着弾することになる。こ のずれを補償するために、制御回路5はV軸方向の相対 位置を調整すべくモータM2に制御信号Svを供給す る。的的の大きさの検出は、検出信号Sp2のパルスの振 幅から検出する。液滴の径が大きければ光を遮る面積が 大きいので、検出信号中のレベル変動も大きくなるから である。液滴の大きさが許容値よりもずれた場合、滴正 な着弾が担保できなくなるので、制御回路5はヘッドの クリーニングをしたり警報を出力したりする措置をす

【0118】本実施形態13によればインクジェット式 記録ヘッドからの液滴の弾道を検出して補正するので、 ヘッドを長時間使用して特性変化が生じた場合やヘッド に癖がある場合でも正確なパターン形成が可能である。 【0119】(その他の変形例)本発明は上記実施形態 によらず種々に変形して適用することが可能である。 なわちインクジェット式記録ヘッドから流動体を吐出す る他に、その吐出前やその吐出後に、または基板に液態 が着弾する前に処理を行うものであれば、木発明の思想成 を目的としていたが、これに拘るものではない。工業的 用途であると民生的用途であるとを問わず、インクジェット式記録ヘッド等からインクを吐出して特定の効果を 別ろものであれば種々ないま業的

【0120】また、上記各実施形態は独立に適用しても 複数を同時に適用してもよい。特にパターン形成が複数 工程によって完了する場合には、複数の処理装置により 処理することは好ましい。例えば、液薬吐出前に表面改 質を第1の配置の処理装置により行って液滴を基板に密 着し易くし、吐出された流動体の液滴の属性を検出しそ の位置補正を行う処理を第3の配置の処理装置で行い、 最後に基板上の液滴の機縮を第2の配置の処理装置で行う 等が考えられる。

[0121]

【発明の効果】本発明によれば、基板上に流動体が吐出 される前に処理可能に構成したので、インクジェット方 式を利用したパターン形成を前処理により促進可能である。 したがって、大がかりな工場設備を利用することなく、安価に基板に任意のパターンを形成することができる。

【0122】本発明によれば、基板上に流動体が吐出された後に処理可能に構成したので、インクジェット方式を利用してパターン形成を後処理により促進可能である。したがって、大がかりな工場を備を利用することなく、安価に基板に任意のパターンを形成することができ

【0123】本発明によれば、流動体が吐出された瞬間 に処理可能に構成したので、空中で液滴を反応させたり エネルギーを加えたりできる。したがって、大がかりな 工場設備を利用することなく、安値に基板に任意のパタ 一ンを形成することができる。

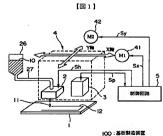
【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の実施形態における基板製造装置の構成 図である。
- 【図2】第1の配置(前処理)の説明図である。
- 【図3】第2の配置(後処理)の説明図である。
- 【図4】第3の配置(吐出直後処理)の説明図である。
- 【図5】実施形態1の処理概念を示す側面図である。
- 【図6】実施形態2の処理概念を示す側面図である。
- THE O'S PRINCIPLE OF STREET CO.
- 【図7】実施形態3の処理概念を示す平面図である。
- 【図8】実施形態4の処理概念を示す平面図である。
- 【図9】実施形態5の処理概念を示す側面図である。

- 24 【図10】実施形態6の処理概念を示す平面図である。
- 【図11】実施形態7の処理概念を示す図であり、
- (a) は平面図、(b) は側面図である。
- 【図12】実施形態8の処理概念を示す図であり、
- (a) は平面図、(b) は側面図である。
- 【図13】実施形態9の処理概念を示す側面図である。
- 【図14】実施形態10の処理概念を示す側面図である。
- 【図15】実施形態11の処理概念を示す平面図であ
- 【図16】実施形態12の処理概念を示す平面図であ
- 【図17】実施形態13の処理概念図である。
 - 【図18】インクジェット式記録ヘッドの分解斜視図で ある。
- 【図19】インクジェット式記録ヘッドの主要部の斜視 図一部断面図である。
- 【図20】インクジェット式記録ヘッドの吐出原理説明 図である。

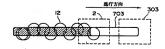
20 【符号の説明】

- 1…基板
- 2…インクジェット式記録ヘッド
- 3、301~330…処理装置
- 4…駆動手段
- 5…制御回路
- 7、701~730…処理の内容

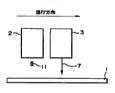




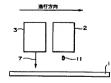
[2]7]

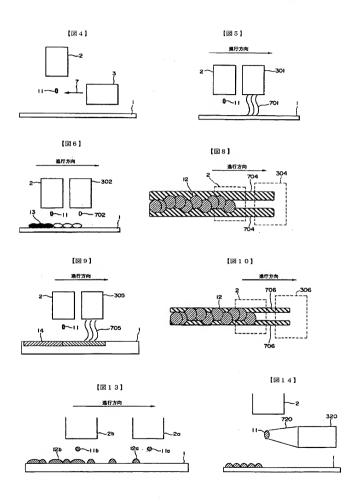


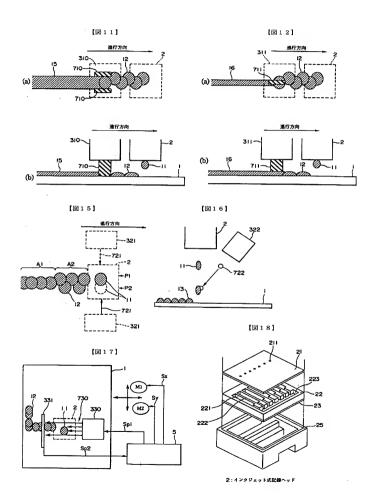
【図2】



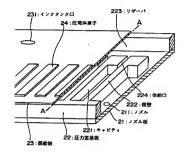
[図3]



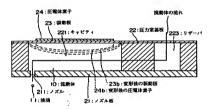




【図19】



【図20】



フロントページの続き

(72)発明者 根橋 聡 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエブソン株式会社内